

# **Séminaire ASTRE : Olivier Latry**

15 Mai 2012, 15:00 – 16:30

## **Titre du séminaire et orateur**

Fiabilité des transistors en mode opérationnel : investigation jusqu'aux échelles ultimes !  
Olivier Latry, Groupe de Physique des Matériaux, UMR CNRS 6634, Equipe de Recherche en Défaillance Electronique et Fiabilité.

## **Date et lieu**

Mardi 15 mai 2012 à 15h.  
ENSEA, Cergy-Pontoise, salle 318

## **Résumé**

Le développement de nouveaux produits intégrant des technologies comme les transistors HEMT à base de Nitrure de Gallium sont encore rares. En se basant sur des critères issus uniquement des fondeurs, il peut être risqué de réaliser un produit en série sans retour d'expériences. C'est la raison pour laquelle, le GPM a proposé d'étudier ce type de composant en conditions opérationnelles et d'approfondir les investigations grâce à de l'analyse microstructurale jusqu'à l'échelle atomique.